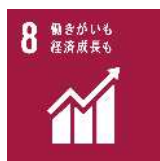


瀬戸市記者会、豊田市政記者クラブ、
豊田市政記者東クラブ同時



本事業は、SDGsの「8 働きがいも経済成長も」「9 産業と技術革新の基盤をつくろう」に資する取組です。

2024年6月7日(金)

あいち産業科学技術総合センター
技術支援部計測分析室

担当 加藤、杉本、太田

ダイヤルイン 0561-76-8315

愛知県経済産業局産業部産業科学技術課
管理・調整グループ

担当 山内、岡田

内線 3388、3380

ダイヤルイン 052-954-6347

計測分析及びシンクロトロン光計測に関する入門講習会 「分析基礎セミナー -目的に応じた元素の調べ方-」の 参加者を募集します

あいち産業科学技術総合センター(豊田市。以下「センター」という。)では企業の新技术・新製品開発や、モノづくり現場で発生する課題の解決の支援として、ICP発光分析装置^{※1}、微小部蛍光X線分析装置^{※2}、走査電子顕微鏡^{※3}、透過電子顕微鏡^{※4}、X線光電子分光装置^{※5}などの計測分析機器を整備・運用しています。また、隣接する「あいちシンクロトロン光センター^{※6}」(瀬戸市)と連携した事業も行っています。

この度、センターの計測分析機器を利用した事例やシンクロトロン光を利用した分析事例についての講習会を開催します。また、講演後は、センターの計測分析機器、瀬戸窯業試験場及びあいちシンクロトロン光センターの見学会、並びに分析法などに関する個別相談会を開催します(希望者のみ)。

参加費は無料です。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

1 日時

2024年7月8日(月) 午後1時から午後5時10分まで(受付開始:午後0時30分)

2 場所

あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室

豊田市八草町秋合1267-1 電話:0561-76-8315

(東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ)

3 定員

80名(センター見学会 30名)(申込先着順)

4 参加費

無料

5 内容

時間	内容
13:00～13:10	開会挨拶 技術支援部 部長 中尾 俊章 <small>なかお としあき</small>
13:10～13:40	「湿式分析について ～ICP発光分析を中心に～」 計測分析室 濱口 裕昭 <small>はまぐち ひろあき</small>
13:40～14:10	「多様な試料に対応できる蛍光X線分析法の紹介」 シンクロトロン光活用推進室 福岡 修 <small>ふくおか おきむ</small>
14:10～14:40	「工業材料における電子顕微鏡(SEM、TEM)を用いた元素分析について」 計測分析室 吉田 陽子 <small>よしだ ようこ</small>
14:40～14:50	休憩
14:50～15:20	「XPS分析による樹脂・金属の化学状態分析の紹介」 計測分析室 加藤 裕和 <small>かとう ひろかず</small>
15:20～15:50	「XAFSによる色を再現するための釉薬の化学状態分析」 あいちシンクロトロン光センター 東 博純 <small>あずま ひろずみ</small>
16:00～16:40	見学会(希望者のみ) 計測分析機器、瀬戸窯業試験場及びあいちシンクロトロン光センター
16:40～17:10	個別相談会(希望者のみ)

6 対象

品質管理や製品開発に携わる企業の方々をはじめ、どなたでも自由に参加できます。

7 申込方法

次のいずれかの方法により、お申込みください。

※申込時点で定員に達していた場合は、電話又はメールにて早急にお断りの連絡をします。

(1) Webページ

以下のURL又は二次元コードからセンターのWebページにアクセスし、「計測分析及びシンクロトロン光計測に関する入門講習会」の申込フォームに御記入ください。また、見学会・個別相談会の参加希望の有無を備考欄に御記入ください。個別相談会に参加希望の場合は相談内容も御記入ください。

申込後に自動返信メールにて確認メールを送信します。

<https://www.aichi-inst.jp/acist/other/seminar/>



二次元コード

(2) メール

件名を「計測分析及びシンクロトロン光計測に関する入門講習会7/8参加申込」とし、企業名、所在地、所属、氏名、電話番号、メールアドレス、見学会・個別相談会の参加希望の有無（個別相談会に参加希望の場合は相談内容）を御記入の上、「10 申込み・問合せ先」までお送りください。

8 申込期限

2024年7月4日（木）午後5時

申込期限前でも定員に達し次第締め切ります。その場合は、センターのWebページでお知らせします。

<https://www.aichi-inst.jp/>

9 主催

愛知県、公益財団法人科学技術交流財団

10 申込み・問合せ先

あいち産業科学技術総合センター技術支援部

計測分析室（担当：加藤、杉本、太田）

電話：0561-76-8315

メール：seminar@chinokyoten.pref.aichi.jp

【用語説明】

※1 ICP発光分析装置

高周波をかけてプラズマ化した気体内に霧状の液体試料を混合させることで、各元素を原子化・熱励起し、それらが基底状態に戻る際の発光スペクトルを測定することで、微量元素の分析を行う。ICPは、Inductively Coupled Plasma（誘導結合プラズマ）の略。

※2 微小部蛍光X線分析装置

X線を材料に照射することで発生する特性X線を検出することで元素分析を行う装置。従来の蛍光X線分析装置と比較し、照射X線径が非常に小さいため微小領域の分析や面分析が可能。

※3 走査電子顕微鏡

絞った電子線を材料に照射し表面の形状を観察する装置。SEM(Scanning Electron Microscope)とも呼ばれる。エネルギー分散型蛍光X線検出器(EDS : Energy Dispersive x-ray Spectroscopy)を搭載すると元素分析も可能となる。

※4 透過電子顕微鏡

絞った電子線を材料に照射、透過させ試料の投影拡大像を観察する装置。TEM(Transmission Electron Microscope)とも呼ばれる。走査電子顕微鏡と同じく、エネルギー分散型蛍光X線検出器を搭載すると元素分析も可能となる。

※5 X線光電子分光装置

X線を材料表面に照射し、放出される光電子を信号として検出する装置。XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy)とも呼ばれる。光電子の結合エネルギーや強度から、ごく表面の物質を構成する元素やその元素の酸化、還元など化学的な状態を知ることができる。

※6 あいちシンクロトロン光センター

公益財団法人科学技術交流財団が整備・運営する、分子や原子レベルで物質の組成等を解析できるナノテク研究に不可欠な最先端の計測分析施設(2013年3月オープン)。

産業利用を主目的とし、隣接するあいち産業科学技術総合センターが備える高度計測分析機器との相互利用によって、地域企業の技術的な課題解決を強力に支援する。

なお、シンクロトロン光とは、ほぼ光速で直進する電子が電磁石によって進行方向を変えられた際に発生する光(電磁波)のこと。非常に明るく、マイクロ波、赤外光、可視光、紫外光からX線まで連続した波長の光を含む。この光を利用して様々な計測・分析を行う。

URL : <https://www.aichisr.jp/>